

SPECTROSCOPIE DE PHOTOÉLECTRONS X (XPS)

FABRICANT : Kratos Analytical

MODÈLE : Axis-Ultra

Analyses

- Appareil multifonctions ayant un système à ultra-haut vide
- Caractérisation en deux dimensions de surfaces hétérogènes par imagerie parallèle XPS résolue en énergie
- Analyse de surfaces couplant 3 techniques de caractérisation : Spectroscopie de photoélectron X (XPS), Ion Scattering Spectroscopy (ISS), Microscopie Auger à Balayage (ASM)

Caractéristiquess

- Source double Mg-Al
- Source Al monochromatique
- Analyseur hémisphérique de grand rayon
- Détection à 8 canaux
- Résolution de 0.48 eV sur l'argent
- Réacteur de haute température et de haute pression intégré

MODES

ISS

- Modèle : ISS Kratos-Ultra
- Résolution : 1.2% avec He 1000 eV (Au)

ASM

- Modèle : AES Kratos-Ultra
- Canon 10 keV LAB6
- Résolution spatiale : 0.1 μm
- S/N : de 500 à 500 keps sur Cu-KLL